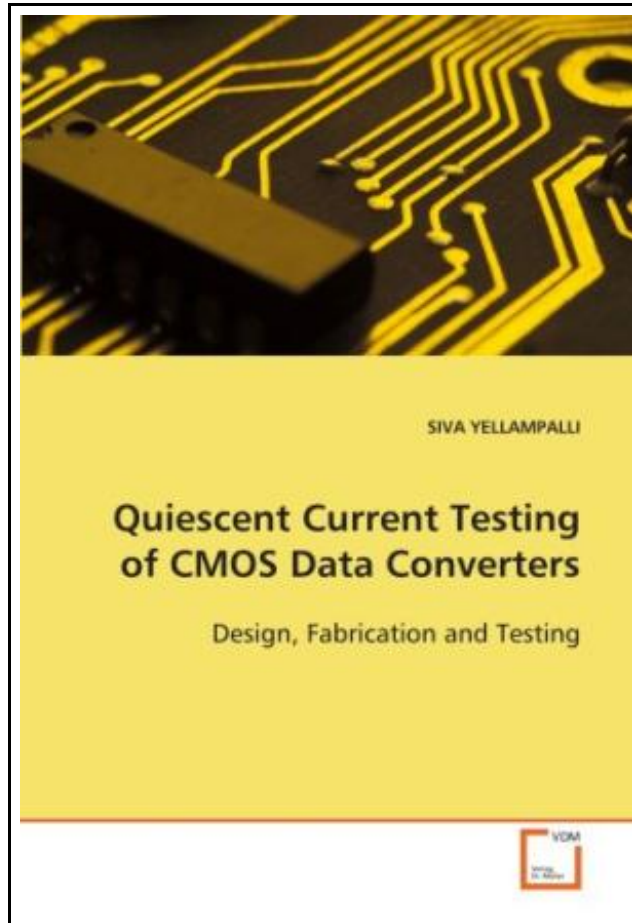


Quiescent Current Testing of CMOS Data Converters



Filesize: 5.39 MB

Reviews

This publication is definitely worth buying. It is written in straightforward words rather than difficult to understand. You are going to like how the writer composed this publication.

(Dr. Joaquin Klein)

QUIESCENT CURRENT TESTING OF CMOS DATA CONVERTERS



VDM Verlag Feb 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x7 mm. Neuware - 1999 fand anlässlich des 70. Geburtstages von Jürgen Habermas ein Symposium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität statt, in dem speziell die Aspekte seines Werkes diskutiert wurden, die das Verhältnis von Rechtfertigung und Wahrheit bzw. Richtigkeit betreffen. Diese Beiträge wurden in dem Band 'Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit' publiziert. Darin findet sich auch eine kritische Auseinandersetzung des amerikanischen Philosophen Hilary W. Putnam mit der Moraltheorie von Jürgen Habermas. Putnam kritisiert die dichotome Trennung von Werten und Normen in der Diskursethik, aus der letztlich das Problem entstehe, dass entweder die in der Diskursethik generierten Normen keinen universellen Status erlangen könnten oder die Trennung zwischen Wert und Norm selbst unhaltbar sei. Aus dieser Kritik entwickelt sich in der Folgezeit eine Debatte um die Frage nach dem Verhältnis zwischen Norm und Wert. Die vorliegende Arbeit führt in die moralphilosophischen Grundpositionen von Habermas und Putnam ein, stellt die spezifische Problematik der Debatte dar und erörtert einige Lösungsperspektiven. Power supply quiescent current (IDDQ) testing has been very effective in detecting physical defects such as open, short and bridging defects in VLSI circuits designed in CMOS processes. However, in sub-micron VLSI circuits, IDDQ current is masked by the increased subthreshold (leakage) current of MOSFETs affecting the efficiency of IDDQ testing. In this work, an attempt has been made to perform robust IDDQ testing in presence of increased leakage current by suitably modifying some of the test methods normally used in industry. In this book we have re-examined both IDDQ and Delta IDDQ methods of testing CMOS VLSI circuits and added features to minimize the influence of leakage current. We have designed built-in current sensors (BICS) for on-chip testing of analog and mixed-signal integrated circuits. We have also combined quiescent current testing with oscillation and transient current techniques to map large number of manufacturing defects on a chip. 116 pp. Deutsch.



[Read Quiescent Current Testing of CMOS Data Converters Online](#)



[Download PDF Quiescent Current Testing of CMOS Data Converters](#)

Other Kindle Books



Psychologisches Testverfahren

Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...

[Save eBook »](#)



Aeschylus

BiblioLife. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 260 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.6in. This Translation of Aeschylus, an entirely new one, is designed as an Appendix to my...

[Save eBook »](#)



Programming in D

Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...

[Save eBook »](#)



Gypsy Breynton

Echo Library. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 88 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.2in. Hon. Gypsy Breynton, Esq., M. A., D. D., LL. D., c., c. Gypsy Breynton, R, R....

[Save eBook »](#)



Memoirs of Robert Cary, Earl of Monmouth

BiblioLife. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 142 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in. The Author of the Memoirs. The Memoirs here presented to the reader may be said to...

[Save eBook »](#)